

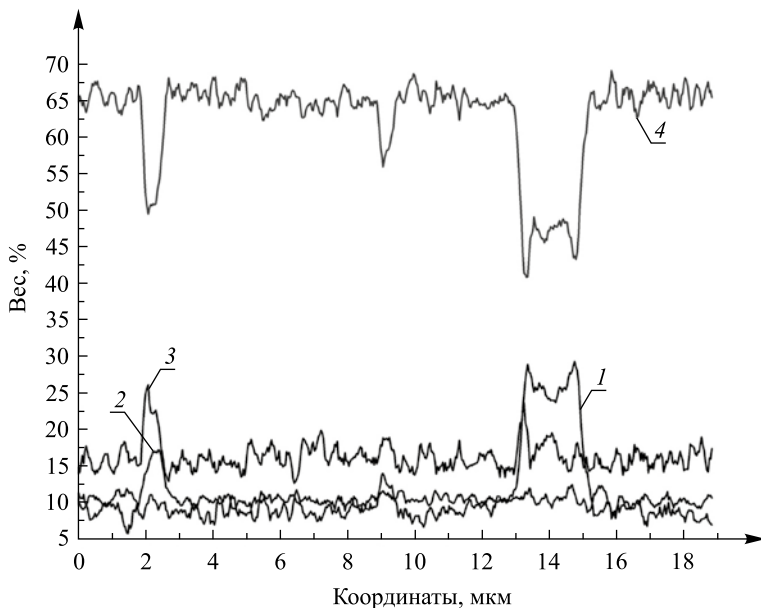
a/a  b/b 

Рис. 2. РЭМ-изображение участка поверхности пленки Ag в TiO_2 на Si-подложке (а) и распределение элементного состава поверхности по линии на этом изображении (б):
1 – Ag; 2 – Ti; 3 – O; 4 – Si

Fig. 2. SEM image of the surface of Ag film in TiO_2 on Si substrate (a) and the elemental distribution on the surface along the corresponding line on the SEM image (b):
1 – Ag; 2 – Ti; 3 – O; 4 – Si